

E DIN 50451-8:2022-01 (D)

Erscheinungsdatum: 2021-12-03

Prüfung von Materialien für die Halbleitertechnologie - Bestimmung von Elementspuren in Flüssigkeiten - Teil 8: Bestimmung von 33 Elementen in hochreiner Schwefelsäure mittels ICP-MS

Inhalt	Seite
Vorwort	3
1 Anwendungsbereich.....	4
2 Normative Verweisungen	4
3 Begriffe	4
4 Einheiten	5
5 Kurzbeschreibung des Verfahrens	5
5.1 Allgemeines	5
5.2 Direkte Messung bzw. Messung nach Verdünnung	5
5.3 Probenvorbereitung durch Abdampfen.....	5
6 Reagenzien	5
7 Geräte und Reinigung	6
7.1 Geräte	6
7.2 Reinigungsverfahren für Gefäße und Pipettenspitzen	6
8 Probenahme und Probenvorbereitung.....	6
8.1 Probenahme.....	6
8.2 Vorbereitung der direkten Messung nach Verdünnung	7
8.3 Probenvorbereitung durch Abdampfen.....	7
9 Blindwerte	7
10 Ermittlung der Bestimmungsgrenze	7
11 Durchführung	7
11.1 Messung.....	7
11.2 Kalibrierung.....	7
12 Berechnung und Angabe der Ergebnisse.....	7
13 Präzision und Richtigkeit des Verfahrens und der Prüfergebnisse.....	8
14 Prüfbericht	11
Literaturhinweise	12